

積體電路可靠度設計 與測試關鍵技術研討會

Workshop of Reliability Design and Testing Technology of Integrated Circuit

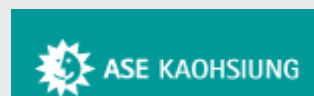
Organizing Committee

柯明道教授/國立交通大學
私立義守大學
王朝欽教授/國立中山大學
洪子聖教授/國立中山大學
吳建銘教授/國立高雄師範大學
王行健教授/國立中興大學
李淑敏教授/國立中山大學

Contact

陳姿文小姐 (07)525-4149
郭容齊小姐 (07)525-4149

Sponsor



研討會主旨

本研討會特別邀請到在靜電防護領域鑽研多年的交通大學柯明道教授，解析靜電防護對奈米積體電路的迫切性與新型全晶片靜電放電防護電路開發的技術，並同時邀請中山大學電機系系主任王朝欽教授、中興大學資工系王行健教授、高雄師範大學電子系吳建銘教授，分別講授多重電壓輸入輸出介面電路設計、低成本多點測試與測試輸出壓縮、射頻積體電路在無線系統的設計與實作以及封裝評估與印刷電路板效應等議題，幫助您迅速了解如何有效提高積體電路的可靠度、測試與封裝的關鍵技術及靜電防護未來的發展趨勢與不可或缺性

報名方式

請一律上網報名，網址：<http://vlsi.ee.nsysu.edu.tw/wshop09/>
TIEEE/T-ESDA/IEEE MTT-S Tainan Chapter 會員 800 元，
非會員 1200 元，學生 300 元

舉辦時間地點

2009 年 10 月 9 日 8:40 a.m ~ 17:00 p.m
國立中山大學圖資大樓 11F 會議室 (高雄市鼓山區蓮海路 70 號)

主辦單位



中山電機

協辦單位



經濟部技術處學界科專辦公室
Department of Industrial Technology



<http://vlsi.ee.nsysu.edu.tw/wshop09>